

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -40℃ ～ +105℃	保存温度範囲	(注2) -10℃ ～ +60℃	
	電 流	1 A	保存湿度範囲	相対湿度 85%以下 (但し結露が無いこと)	
	電 圧	AC 250V			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	30 mΩ以下	○	—
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で 測定する。	30 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 650Vの電圧を 1 分間印加する。	絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗:60 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 振 性	周波数 20 ～ 200Hz、加速度43.1m/s ² 3方向3時間試験する。	① 10μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗:60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 衝 撃 性	周波数20～50Hz、加速度66.6m/s ² 1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗:60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	ロック 強 度	98N以下の引張力をかん合軸方向に 加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	○	
環 境 的 性 能	耐 湿 性	温度60℃、湿度90～95%中に96時間 放置する。	① 接触抵抗: 60mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100MΩ 以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	熱 衝 撃	温度-40℃→常温→105℃→常温 時間 30 → 5 → 30 → 5分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗: 60mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100MΩ 以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 熱 性	温度105℃中に300時間放置する。	① 接触抵抗: 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐亜硫酸ガス性	濃度500ppm、8時間放置する。	接触抵抗: 60mΩ以下	○	—
	はんだ耐熱性	指定の温度プロファイルに2回通して 試験する。	外観の変形及び端子などに著しいガタが ないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度245℃、浸漬時間3秒のはんだ付け を行う。	はんだ浸漬面95%以上が新しいはんだで ぬれていること。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考 注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. 保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			承認	HH. TSUKUMO	20200321
			検 図	HH. TSUKUMO	20200321
			担 当	DONGCHAN KIM	20200320
			製 図	YK. MITSUISHI	20200316
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-167886-55-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	GT8E-20DP-2H (55)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL758-1010-4-55	△ 1/1